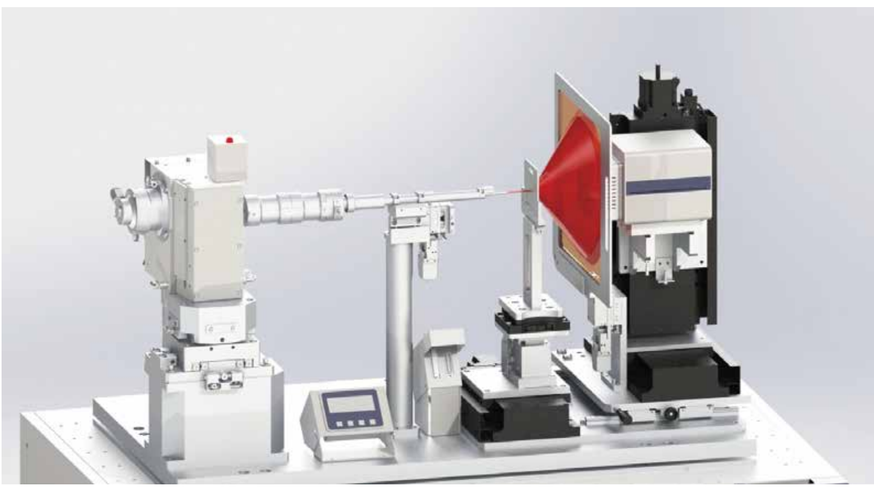
高分子材料の
結晶化度・配向度評価

多彩な試料環境も、高速測定も、すべてはこの一台で

X線回折システム **DicifferX** (WAXS Edition)

装置の特長

■ DicifferXの光学系



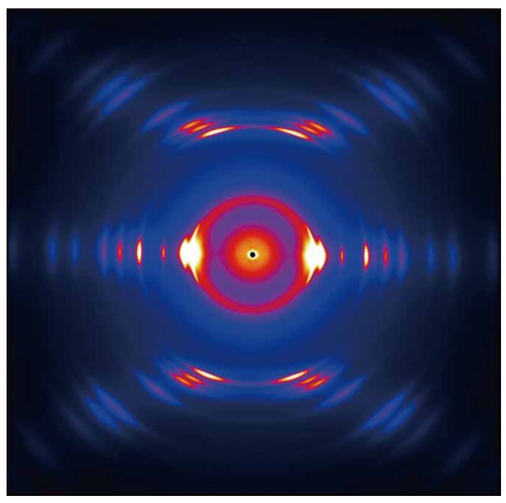
ハイスループット
高強度・高輝度 X 線源を搭載し、スピーディなデータ取得を実現

あらゆる材料に対応
バルク材からファイバー、フィルムまで幅広くカバー

多彩な試料環境に対応
広い試料スペースで、さまざまなアタッチメントと柔軟に組み合わせ可能

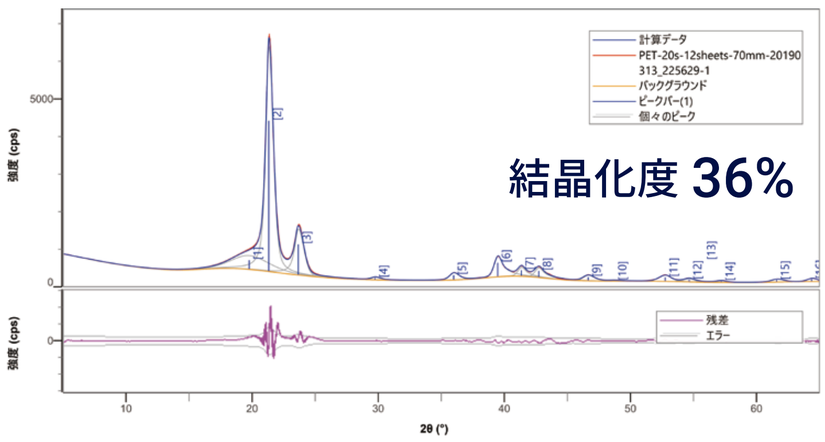
結晶化度・配向度

■ 2D image : PET film



露光時間10秒

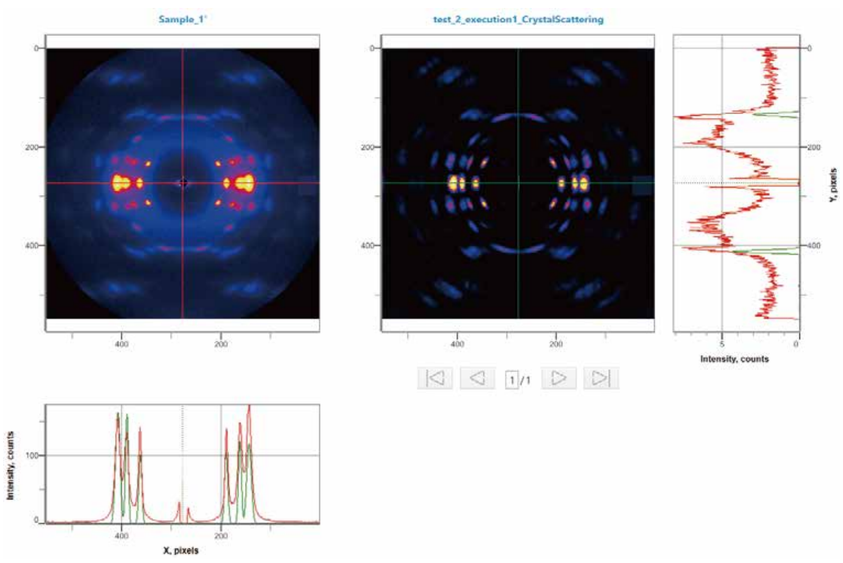
■ Converted 1D profile and fitting profile



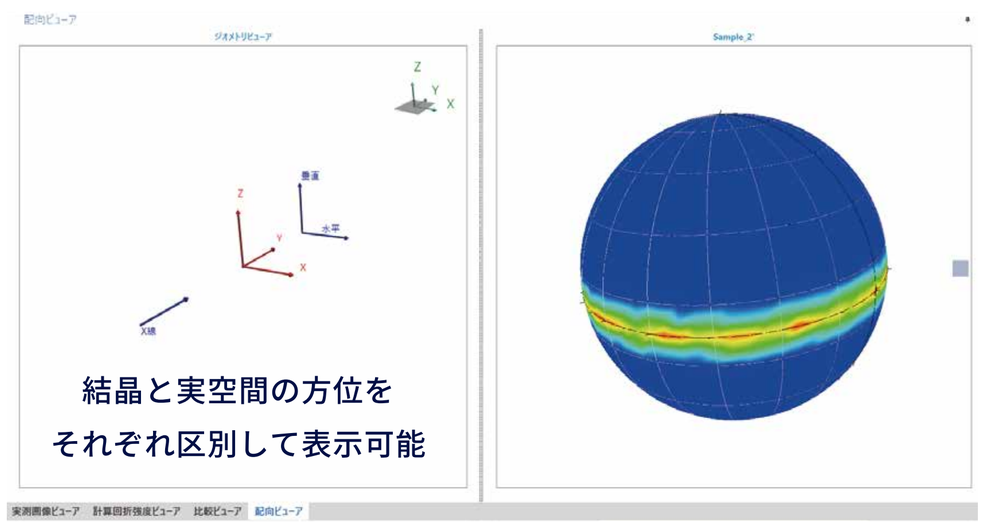
- Full2D 測定（方位角方向 360°）により、結晶部の配向状態を一目で把握
- 結晶化度の解析も専用フローによりスムーズに実行可能
- 微小 X 線ビームによるマッピング測定で、微細領域の構造変化も高精度に可視化
- 複数サンプルの反射測定にも対応

結晶性高分子向けのX線回折シミュレーター PolyOrientX

結晶性高分子材料のシミュレーター機能



配向度分布解析機能



Rigaku

rigaku.com

© Rigaku Holdings Corporation and its Global Subsidiaries. All rights reserved.